

講演1：LSI テスト技術の応用および技術動向（VTS2017 報告）

講師：畠山一実先生（群馬大学客員教授）

日時：2017年7月25日（火） 12:40～14:10

場所：群馬大学工学部（桐生キャンパス）総合研究棟 402号室

概要：

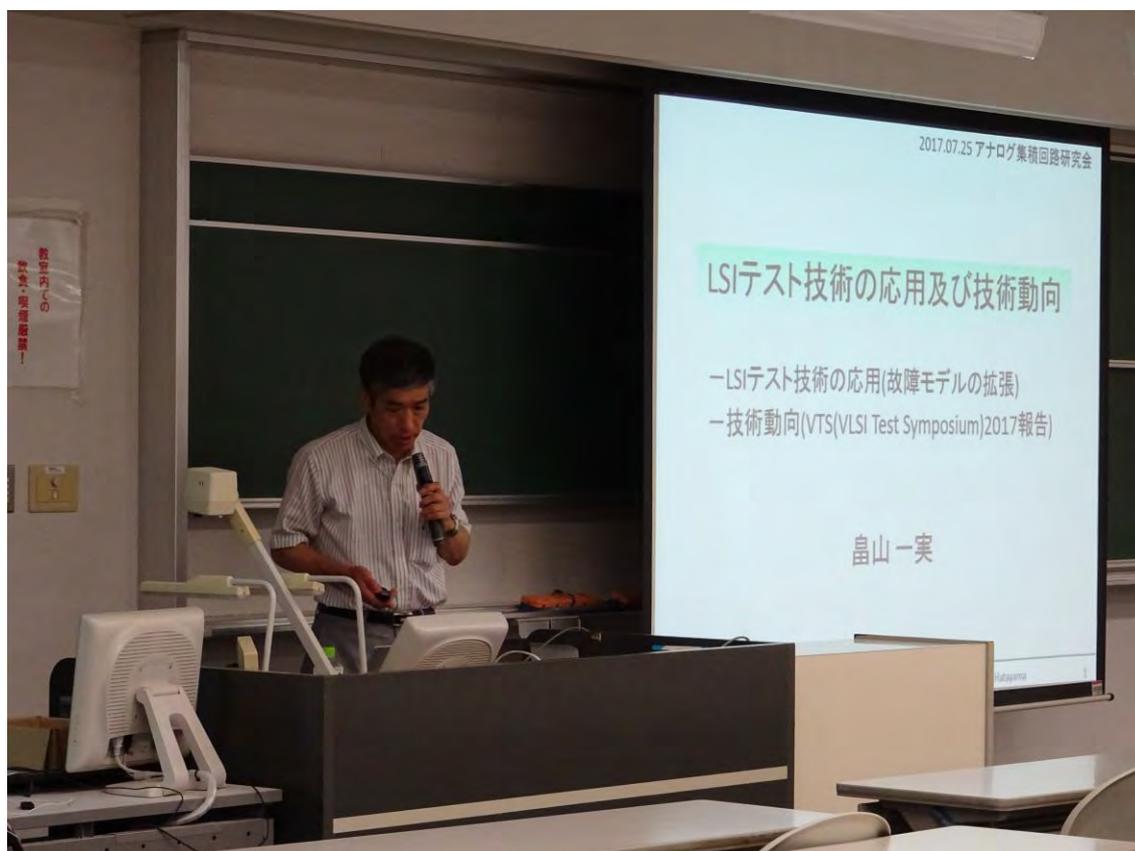
IoT時代を迎え、LSIの応用分野の拡大に伴ってその品質を確保するためのテスト設計の重要性が一段と高まっています。本講演では、最初にLSIテスト技術の応用として、故障モデルの拡張について紹介します。その後、LSIテスト技術の動向として、今年の4月に米国で開催されたVTS (VLSI Test Symposium) 2017について報告します。

VLSI Test Symposium 2017

http://www.ttc-vts.org/public_html/new/2017/index.html@p=51.html

講演資料

<http://www.el.gunma-u.ac.jp/~kobaweb/lecture/2017-7-25hatayama.pdf>



第332回 群馬大学アナログ集積回路研究会（講演1）



第332回 群馬大学アナログ集積回路研究会（講演1）



第332回 群馬大学アナログ集積回路研究会（講演1）



第332回 群馬大学アナログ集積回路研究会（講演1）



- 「一流製品としての信用を得たのは、
悪い製品を世に出さなかったのがもっとも大きな理由です。」
ソニー 盛田昭夫氏
- 「最近では低コスト化に加えて いかにして**差別化**するかが求められている。」
応用科学学会副会長 久保文雄氏
- 「**低コスト**」とともに「**高品質**」を目指すのは
モラルの高い日本社会に適していると思う。
- 大学院講義「計測制御工学特論」、学部3年生講義「集積回路システム工学」
の補講も兼ねたため、学生を中心に教職員・学外の方も含めて
聴衆は160名程度。群馬大OBの方も何名も参加。会場は熱気に溢れる。

写真提供 群馬大学 石川信宣

企画・文責 小林春夫